

## 新製品「IPD/IPM テストシステム」に関するお知らせ

### 【概要】

当社が半世紀に渡り蓄積してきたパワーディスクリート半導体の測定技術をベースに、IC テスタの技術を取り入れた全く新しいコンセプトの IPD/IPM（インテリジェント・パワー・デバイス / インテリジェント・パワー・モジュール）用テストシステム(530-IT)を製品化しました。

### 【内容】

レガシー材料の Si や化合物半導体の SiC/GaN を用いたパワー半導体はモビリティの電動化や省エネ化には欠かせません。システムの高効率化に向けて、これらパワー半導体をゲート制御する回路や保護機能を搭載した IPD/IPM は注目され、需要の増加が見込まれています。

このようなトレンドを受け、当社が培ってきたパワーディスクリート半導体の測定技術を活かした新プラットフォームを構築し、IPD/IPM 用にフルモデルチェンジしました。従来品ではテストヘッドを2台備えたシステムはシーソー（シリアル）方式の測定でしたが、本製品では完全パラレル測定が可能となりコストパフォーマンスが飛躍的に向上しました。

### 【特徴】

- ・パワーディスクリートデバイス用テスタの測定技術を活用
- ・最大スペックは 2.2kV/67A（最大 200A）。外部ユニットの追加で拡張も可能。
- ・パラレル測定（2 個同時測定）にも対応
- ・言語レスで容易なテストプログラム作成（穴埋め方式）
- ・リーク（漏れ電流）測定の高速度化
- ・多様なバイアス印加波形と印加タイミング

当社は今後もパワー半導体における検査装置のリーディングカンパニーとして、お客様のニーズに応え、高品質な測定を実現する製品を通して、社会に貢献して参ります。



IPD/IPM テストシステム MODEL:530-IT

**【お問い合わせ先】**

〒207-0023 東京都東大和市上北台 3 丁目 391-1

株式会社テセック 営業統括部

TEL: 042-566-2111, E-mail: [info@tesec.co.jp](mailto:info@tesec.co.jp)

以上